

EDH3101W

双 85 可靠性测试系统

Version 1.1





产品描述

联讯仪器的 EDH3101W 双85老化系统，应用于不同材料HBT及pHEMT(增强型/耗尽型)器件高温高湿环境下的长时间可靠性试验。EDH3101W双85老化系统提供的Vds/Vce电源由二级驱动板电源提供，Vgs/Vbe老化电压由自制可调系统根据Ids/Ice电流值反馈控制供给。试验过程中系统自动恒定每个试验工位的Ids/Ic电流、Vds/Vce电压，确保每个试验工位自动调整到一致的试验条件状态下，并进行实时调节ds/ce端电流，监控gs/be、ds/ce端的电压、电流，达到可靠性老化筛选的功能。

产品特点及优势

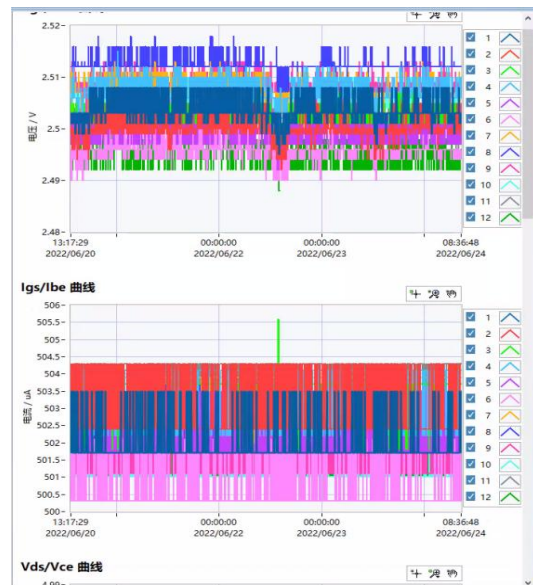
- 大容量：共支持216颗DIP封装的老化；
- 监控参数完整：包括监控GS/BE电压电流，DS/CE电压电流；
- 恒IDS/ICE控制老化功能；
- 图形化显示不同监控参数值，包括温度、GS/BE电压电流，DS/CE电压电流；
- 支持软件定制开发连接客户MES系统和数据库；
- 支持开门报警，开门断电等防呆功能；
- 内置UPS电源，有效保护老化过程中异常数据的丢失；
- 满足EOS、ESD防护以及EHS要求；
- 软件支持权限和账户管理；

软件功能

联讯仪器的EDH3101W测试软件平台为可配置性平台，用户界面简约直观。



老化软件界面



器件参数曲线



技术指标

系统功能	外形尺寸(mm)	800*2000*1700+1000*2000*1000
	支持夹具类型	标准DIP夹具
	系统支持TO数量	218个
	系统温区	独立两个温区
	SN批量输入	支持夹具上条码识别, 批量输入产品SN
	MES系统接口	支持定制开发对接客户的MES系统和数据库
	数据保存	测试原始数据、计算结果、系统运行详细日志的保存
	系统供电	380V
温度控制	温度范围	常温到 85°C
	温度升温速度	>3°C/分钟(空载) >1.5°C/分钟(满载)
	温度控制精度	0.1°C
	温度准确性	±1°C
	温度均匀性(空间9点产品位置)	±2°C满载(≤80°C)
电器参数	驱动板类型	每个通道独立操作和控制
	VGS/VBE电压范围	-5V~5V 精度<1%FS
	IGS/IBE电流范围	-2mA~2mA 精度<1%FS
	VDS/VCE电压范围	0~15V 精度<1%FS
	IDS/ICE电流范围	0~100mA 精度<1%FS
	恒IDS/ICE老化功能	自动调节VGS/VBE, 使IGS/ICE恒定电流老化
安全保护	正常操作下电	正常
	正常操作上电	正常
	市电掉电	正常
	市电上电	正常
	ESD	使用防ESD材料 表面电阻: $1 \times 10^5 \Omega < X < 1 \times 10^9 \Omega$; 摩擦电压: < 100V; Grounding; 系统中所有孤立导体必须接地处理, 所有仪表必须接地处理, 机架必须接地处理, 接地电阻<4ohm 鼠标键盘需要防ESD处理
	安全	设备没有尖锐棱角, 没有漏电风险
	清洁	系统没有掉屑, 掉漆和生锈现象

采购信息

EDH3101W	联讯低功率双85老化系统
选件信息	标准选件



联系我们

销售

销售中心负责人	186-6029-8596 杨建
光芯片老化测试	189-7147-3511 张纪
光通讯测试仪器	186-2613-2729 邓寒
高精度精密源表	185-2212-4627 张盼盼
半导体测试设备	186-6230-5688 梁仕帮

邮箱

销售部 sales@semight.com

地址

苏州高新区湘江路 1508 号 1 号楼

关于联讯

联讯仪器位于苏州高新区湘江路 1508 号，是国内高端测试仪器和设备提供商。联讯仪器主要专注于高速通信测试，光芯片测试和半导体测试三大领域，可以提供包括高速误码仪、网络测试仪、宽带采样示波器、高精度波长计、光谱仪，通用数字源表等高端测试仪器，以及高速光电混合 ATE，激光器芯片老化机，激光器芯片测试机，硅光晶圆测试机，功率芯片测试机，晶圆老化机等高端测试设备。

联讯仪器坚持以客户为中心，以员工为根本，以创新为驱动，尽精微致广大的企业文化，心怀不断填补国内高端测试仪器设备空白的使命，为达成国内领先、国际知名的高端测试仪器设备提供商的愿景而不懈奋斗。

更多信息请访问 www.semight.com

*本文中的产品指标和说明可不经通知而更新